

کنترل کیفیت بلاذرنگ محصولات و تحقق آن در صنایع کاشی با کمک ماشین بینایی

سعید طوسی زاده - علی پیروی

peiravi@netscape.net - saeedtoosizadeh@yahoo.com

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده: در این مقاله روشی سریع برای تحلیل، مقایسه و استنتاج تصویر معرفی می شود که برای پاده سازی بر روی یک خط تولید جهت آشکار سازی نقص مناسب می باشد. اساس کار بر مبنای تکنیک n تایی و استنتاج های فازی است. در تکنیک n تایی مشخصه هایی از تصویر شیء بدون نقص و شیء تحت آزمایش استخراج می شود و در مقایسه بین تعداد وقوع این مشخصه ها، معیاری از کیفیت ظاهری شیء تحت آزمایش بدست می آید. ابزارهای آماری و تکنیک های پردازش تصویر در جهت بهبود تایی عملی تکنیک n تایی به کار گرفته می شود و نهایتاً با استفاده از استنتاج فازی، درجه کیفیت شیء مورد نظر تعیین می گردد. این روش یک استراتژی جدید که برتری هایی از لحاظ سرعت، دقت، سادگی و قابلیت تغییر کاربرد بر روشنها برای اخیر دارد ارائه می دهد، به طوری که یک راه حل اقتصادی همراه با در نظر گرفتن گوناگونی در نوع کاربرد عرضه می کند. کاربرد این روشها برای طیف وسیعی از کالاهای تولیدی در کارخانجات قابل تحقق بوده و توسط مولفین برای کاشی محقق شده است.

کلمات کلیدی: کنترل کیفیت بلاذرنگ، استنتاج فازی، بازبینی اتوماتیک، بینایی ماشین، تکنیک n تایی

مقدمه

هر تکنیک برای داشتن کاربرد عملی در بازبینی اتوماتیک، باید دو هدف اصلی را تحت پوشش قرار دهد که این دو هدف، سرعت عمل و قابلیت تغییر کاربرد می باشد. به قصد رسیدن به این اهداف، روشهای بازبینی گوناگونی ارائه شده که عمدتاً در یکی از سه دسته بزرگ زیر قرار می گیرند:

کاهش تصویر (Image Subtraction)، طراحی پایگاه قوانین (Design Rule Based) و مدل مبنای (Model Based).

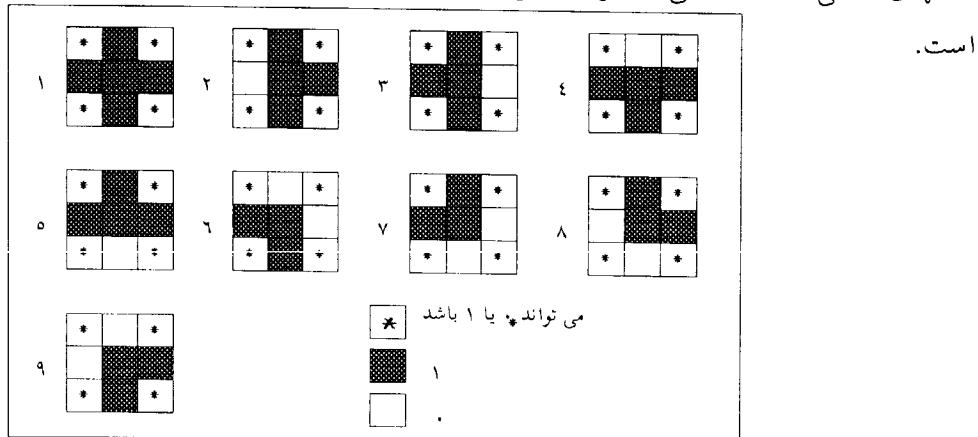
هر یک از این روشهای مزایایی دارند که در قبال بهبود یک هدف، دیگری زیان می بیند. تکیبکی که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد تکنیک n تایی می باشد و اهداف فوق را تا حدود زیادی برآورده می سازد. این تکنیک اولین بار در سال ۱۹۵۰ معرفی شد و در ابتدای ۱۹۸۰، Aleksander گروهش برای ساختن دستگاه شناسایی طرح WISARD از آن استفاده کردند [۱].

در ادامه ابتدا تکنیک n تایی را برای تصاویر دودویی بررسی می کنیم و تایی را به تصاویر با چند سطح خاکستری گسترش می دهیم سپس روش های پردازش تصویر و ابزارهای آماری را در جهت بهبود تایی عملی تکنیک n تایی به کار گرفته و درنهایت چگونگی استفاده از استنتاج های فازی را در رابطه با تعیین درجه کیفیت ظاهری ارائه می دهیم.

تکنیک n تایی

یک n تایی مجموعه ای از پیکسلهای منظم می باشد، که به عنوان یک " واحد " پردازش می شود. برای دست یابی به کارآئی مناسب، انتخاب عدد n و ترکیب n پیکسل بسیار مهم می باشد [۲]. در صورتی که تصویر دودویی داشته باشیم، به طوری که هر پیکسل فقط دو مقدار ۰ (پس زمینه) یا ۱ (شیء) را اختیار کند، تعداد حالتها برای هر n تایی 2^n خواهد بود. بر اساس تجربیات به دست آمده به منظور بهینه سازی کارآئی تکنیک n تایی از لحاظ سرعت، دقت، سادگی و قابلیت تغییر کاربرد، از میان حالت های مختلف n تایی حالت $n=5$ بر مبنای یک سری استانداردها برای اکثر کاربردها مناسب می باشد [۱، ۳، ۴].

برای $n=5$ ، n تایی به شکل صلیبی در نظر گرفته می شود و حالت های مختلف به دست آمده ناشی از صفر یا یک قرار دادن پیکسل های آن، مشخصه های n تایی را تشکیل می دهد (شکل ۱). مشخصه ۱ به شناسایی داخل شیء محدود می شود، مشخصه های ۲ و ۳ جهت عمودی و مشخصه های ۴ و ۵ جهت افقی را استخراج کرده و دیگر مشخصه ها اطلاعات مربوط به لبه ها را در بر دارند. به عنوان نکته ای مهم، ۲۳ مشخصه دیگر (منطبق با ترکیبات باقیمانده از ۵ پیکسل مهم) به عنوان نمایشی از نویز (پیکسل های مجرد : پیکسل ۱ در همسایگی ۰ یا برعکس) یا حالت های اضافی به حساب می آیند و بنابراین در نظر گرفتن این مشخصه ها در بسیاری از مسائل بازبینی نامناسب است.

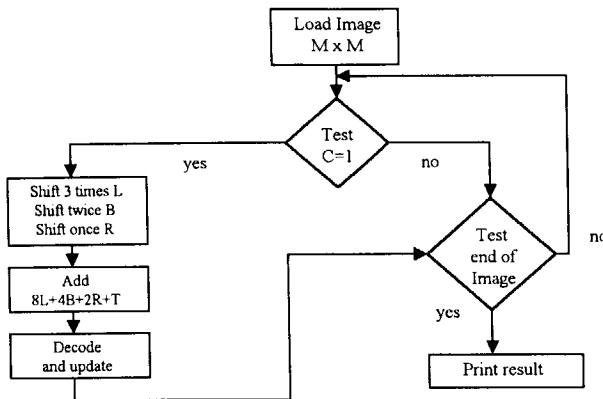


شکل ۱. مقادیر مختلف مشخصه های انتخاب شده

در یک تصویر داده شده، با قرار دادن پیکسل مرکزی هسته 3×3 بر روی هر پیکسل تصویر، به جستجوی تعداد وقوع مشخصه ها می پردازیم. سرعت عمل تکنیک، به روش جستجوی وقوع مشخصه ها بستگی دارد. با توجه به اینکه تمام مشخصه ها دارای پیکسل مرکزی ۱ (روشن) می باشند، وزنی به چهار وضعیت مهم متصل به پیکسل مرکزی در هسته 3×3 نسبت داده می شود. در حالت تصاویر دودویی وزن ها توان هایی از ۲ هستند که می توانند ۱، ۲، ۴ و ۸ باشند. این نمایش به ما اجازه خواهد داد که نه مشخصه را به صورت منحصر به فردی تشخیص دهیم و بدین ترتیب ثبت تعداد وقوع آنها به راحتی با استفاده از عمل اصلی انتقال (Shift) به جای ضرب انجام می گیرد. الگوریتم منتج در شکل ۲ نمایش داده می شود. به عنوان نتیجه، یک مشخصه توسط عدد دهدۀ $8i_3 + 4i_2 + 2i_1 + i_0$ تعیین می گردد که ۱ یا $i_k = 0$ برای تمام مقادیر $\{0, 1, 2, 3\}$ است.

تصاویر دودویی

در بسیاری از موارد که شیء مورد آزمایش تماماً از یک جنس بوده و پس زمینه تصویر با جزئیات شیء از لحاظ روشنایی تداخل نداشته باشد (یا به عبارتی اختلاف سطح خاکستری آنها زیاد باشد)، در صورت نوربرداری صحیح



شکل ۲. الگوریتم استخراج مشخصه ها

و قرار دادن سطح آستانه مناسب می توان به تصویر دودویی کاملی از شیء دست بافت. اغلب در تصاویر دودویی نقایص را بر اساس شکل و اندازه دسته بندی می کنند. اندازه گیری ها توسط مساحت نقص و فشردگی آن ($C = \frac{P^2}{A}$)، که از توزیع آماری مشخصه ها بدست می آیند، انجام می گیرد. محیط و مساحت نقص را می توان به ترتیب، توسط روابط زیر تقریب زد.

$$P = \sum_{i=2}^{i=5} f_i + \sqrt{2} \sum_{i=6}^{i=9} f_i \quad (1) \qquad A = \sum_{i=0}^{i=9} f_i \quad (2)$$

که f_i تعداد وقوع امین مشخصه در یک تصویر داده شده می باشد.

برای آشکار کردن نقص توسط تکنیک n تابی، ابتدا تصویری از شیء بدون نقص تهیه کرده و مشخصه ها را از این تصویر استخراج می کنیم، سپس این عمل را بر روی شیء تحت بازبینی انجام می دهیم. در یک راستا بودن دو شیء در دو تصویر لازمه اجرای صحیح الگوریتم می باشد، که معمولاً در عمل مشکل آفرین خواهد بود. توسط رابطه (۳) برای تمام آها $\{1, 2, \dots, 9\} \in n$ اختلاف را محاسبه می کنیم.

$$\Delta f_i = f_i - f'_i \quad (3)$$

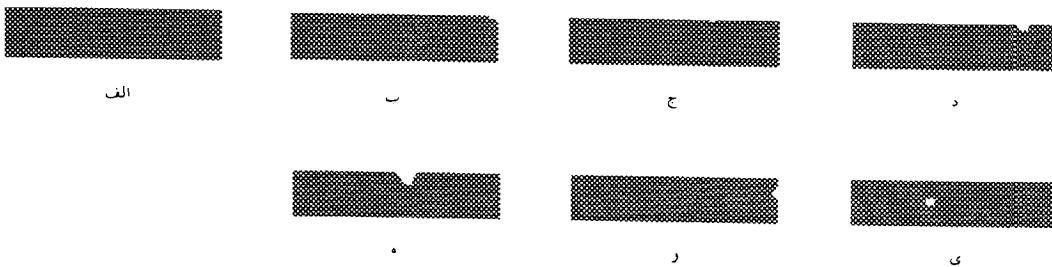
که Δf_i شماره مشخصه است، f_i و f'_i به ترتیب تعداد وقوع امین مشخصه متناظر تصاویر مرجع و نقص دار می باشند. در این شرایط اگر هیستوگرام مشخصه های مشابه استخراج شده از دو تصویر متفاوت باشند، نقصی آشکار می شود و این در صورتی است که عبارت داده شده با معادله (۳) برای تمام آها $\{1, 2, \dots, 9\} \in n$ مساوی صفر نباشد.

بررسی نتایج در یک مثال ساده

برای روشن تر شدن عملکرد این الگوریتم مثالی ساده از یک شیء مستطیلی شکل در نظر می گیریم. شکل ۳-الف تصویر شیء بدون نقص را نشان می دهد و نتایج حاصل از اعمال الگوریتم فوق به اشیاء تحت آزمایش (شکل های ۳-ب تا ۳-ه) در جدول ۱ آمده است.

در این جدول ۵۱ معیاری از اندازه نقص می باشد. در حالت (ب) نبودن گوشش شیء باعث کمبود مشخصه های ۳ و ۴ و زیاد شدن مشخصه ۶ می شود. در حالت های (ج)-(د)-(ه) که به ترتیب اندازه نقص افزایش یافته، کمبود مشخصه ۴ حاکی از نقص در ضلع بالایی شیء می باشد. نقص موجود در ضلع راست شیء حالت (و)، علت کمتر شدن مشخصه ۳ است. در حالت (ی) نقص در درون شیء می باشد که باعث کاهش مشخصه اول و افزایش

مشخصه های دیگر شده است و بدین ترتیب این نقص افزایش نقاط مرزی را در برداشته چرا که مشخصه های ۲ تا ۹ بیانگر نقاط حاشیه ای می باشند.



شکل ۳. نمایش نمونه های مختلف نقص در یک شیء مستطیلی

حالت ها	اختلاف مشخصه ها								
	$\Delta 1$	$\Delta 2$	$\Delta 3$	$\Delta 4$	$\Delta 5$	$\Delta 6$	$\Delta 7$	$\Delta 8$	$\Delta 9$
ب	۵۳	.	۸	۸	.	-۸	.	.	.
ج	۱۷	-۱	-۱	۴	.	-۲	.	.	-۲
د	۱۰۸	-۴	-۲	۱۲	.	-۷	.	.	-۱۲
ه	۲۹۳	-۹	-۵	۲۰	.	-۱۲	.	.	-۸
و	۶۳	.	۷	-۳	-۱	-۲	-۶	.	-۱
ی	۸۴	-۳	-۴	-۵	-۶	-۲	-۲	-۲	-۳

جدول ۱. نمایش نقص های مختلف حالت های شکل ۵ توسط مشخصه ها

بنابراین می بینیم که با استفاده از این الگوریتم قادر به تفکیک حالت های مختلف نقص خواهیم بود. در شرایطی که شیء تحت آزمایش بیرون زدگی داشته باشد، مقدار $\Delta 1$ منفی خواهد شد که بیانگر اضافی بودن مشخصه ۱ در تصویر شیء نقص دار نسبت به شیء بدون نقص می باشد.

کارآیی تکنیک n تابی

در رابطه با الگوریتم مورد استفاده برای استخراج وضعیت n تابی ها که در شکل ۴ نشان داده شده، زمان پردازش به محتویات تصویر بستگی دارد. تصویری با یک شیء فشرده بزرگتر، زمان پردازش بیشتری در مقایسه با یک شیء کوچکتر نیاز خواهد داشت. با استفاده از زبان C برای اجرای این تکنیک، مقدار میانگین سرعت عملکرد برای یک تصویر استاندارد ۵۱۲ در ۵۱۲ بروی چند نمونه رایانه به صورت زیر می باشد (در این تصویر مساحت شیء در حدود یک هشتمن اندازه کل تصویر است).

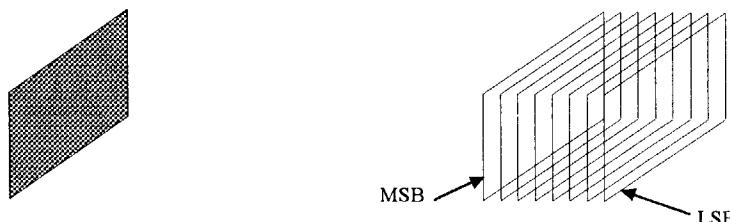
نوع رایانه	زمان گرفته شده (ثانیه)	تعداد پیکسل پردازش شده در ثانیه
Intel-CPU 486-33MHz	0.27	10^6
Intel-CPU 486DX2-66MHz	0.21	1.2×10^6
AMD-CPU 5x86-133MHz	0.16	1.6×10^6
Intel-CPU Pentium-200MHz	0.07	3.7×10^6

دقت این الگوریتم در حد نقصی به کوچکی یک پیکسل در شیءی که حداقل یک پنجه سه در سه را در تصویر اشغال می کند، می باشد. بنابراین برای افزایش دقیق سیستم، می توان دقیق تصویر را افزایش داد تا شیء و کوچکترین نقطه نظر در تصویر به راحتی با حداقل تعداد پیکسل های بیان شده برای استخراج نقص نمایش داده شوند. مزیت دیگر این الگوریتم، استفاده مفید از حافظه می باشد. در آغاز یکبار تصویر شیء بدون نقص وارد

حافظه شده و پس از استخراج مشخصه های n تایی آن، دیگر نیازی به تصویر اصلی نیست و می توان حافظه را به تصویر اشیاء تحت آزمایش اختصاص داد و مشخصه های آنها را استخراج نمود. به این ترتیب لازم نیست تصویر شیء بدون نقص و شیء تحت آزمایش به طور همزمان در حافظه قرار گیرند.

تصاویر با سطح خاکستری

استفاده از تصاویر با چندین سطح خاکستری، کاربرد تکنیک n تایی را مشکل می کند، به طوری که اگر مقادیر پیکسل های مشخصه، مجاز باشند مقادیر غیر از ۰ و ۱ اختیار کنند، تعداد مشخصه ها بشدت افزایش می یابد. برای حفظ سادگی تکنیک n تایی در حد حالت دودویی، بدون از دست دادن کلیتی در کاربرد آن، سطح خاکستری هر پیکسل تصویر را با N رقم تجزیه می کیم. بنابراین N سطح دودویی تشکیل می شود که همان دقت در مختصات تصویر اولیه را دارد (شکل ۴) و نتیجتاً اطلاعاتی از بین نخواهد رفت.



شکل ۴. تجزیه سطح بیت $MSB =$ با اهمیت ترین سطح بیت $LSB =$ کم اهمیت ترین سطح بیت

سمت راست: تصاویر دودویی (1 سطح بیت) - سمت چپ: تصویر با سطح خاکستری (2^N سطح خاکستری) این روش که تجزیه سطح بیت (bit-plane decomposition) نامیده می شود^[۵]، مقدار پیکسل x_{ij} داده شده در تصویر اولیه را با استفاده از معادله زیر تجزیه می کند.

$$x_{ij} = 2^{N-1} x_{(N-1)ij} + \dots + 2^P x_{Pij} + \dots + x_{0ij} \quad (4)$$

که $x_{(N-1)ij}, \dots, x_{0ij}$ صفر یا یک هستند و متناظراً مقادیر پیکسل ها را به ترتیب برای N سطح دودویی در موقعیت (i,j) برای تمام $i, j \in \{0, \dots, M-1\}$ (در یک تصویر $M \times M$) نمایش می دهند و $P = \log_2 N$ می باشد، که P تعداد سطوح خاکستری است. مانع اصلی تجزیه سطح بیت این است که تغییرات کوچک در یک سطح خاکستری می تواند تاثیر مهمی بر ترکیب سطح بیت ها داشته باشد. یک راه حل در نظر گرفتن سطوح دودویی مرتبه بالا (با ارزش تر) می باشد، که این سطوح بیشترین خصوصیات نمایشی تصویر را در بر دارند. معادله زیر به منظور نزدیک مقادیر سطوح خاکستری اولیه توسط چهار سطح دودویی برای یک تصویر با 2^6 سطح به کار می رود.

$$x_{ij}^* = 2^7 x_{7ij} + 2^6 x_{6ij} + 2^5 x_{5ij} + 2^4 x_{4ij} \quad (5)$$

بنابراین مراحل مختلف الگوریتمی که به منظور شناسایی نقص در تصاویر با سطح خاکستری استفاده می شود به صورت زیر است:

- ۱- چهار سطح دودویی را از تصویر الگو به دست می آوریم.
- ۲- تعداد وقوع نه مشخصه برای چهار تصویر دودویی را ثبت می کنیم.
- ۳- چهار سطح دودویی را از تصویر آزمایشی به دست می آوریم.
- ۴- تعداد وقوع نه مشخصه برای چهار تصویر دودویی را ثبت می کنیم.
- ۵- اختلاف مرتبه وقوع مشخصه های استخراج شده از سطوح متناظر را محاسبه می کنیم.

توجه کنید که محدود شدن به چهار سطح یک انتخاب بهینه نیست، خصوصاً زمانی که بر روی تعداد سطوح خاکستری محدودیت داریم. در چنین حالتی، استفاده از یک مرحله پیش پردازش را توصیه می کنیم که بر اساس هیستوگرام تصویر، تعداد سطوح دودویی بهینه را نتیجه می گیریم.

الگوریتم استفاده شده برای تصاویر با چند سطح خاکستری، به دلیل ساختار منظم با دستورات محدود همراه با محاسبات تکراری و یکنواخت، پتانسیل مناسبی برای پردازش موادی ارائه می دهد. با توضیحاتی که در رابطه با تکنیک ۷ تابی داده شد متوجه برتری های این تکنیک از لحاظ سرعت، دقیق، سادگی و استفاده مفید از حافظه نسبت به روش های دیگر می شویم و آن را یک روش مفید و موثر جهت عیب یابی معرفی می کنیم. به عنوان نمونه کاربرد عملی، از این تکنیک برای عیب یابی و درجه بندی کاشی استفاده کرده ایم که شرح سیستم به قرار زیر است.

اجرای عملی طرح بر روی کاشی

به منظور اجرای عملی طرح لازم است سیستمی برای انتقال تصویر به کامپیوتر طراحی گردد که در آن مناسب بودن تصاویر از نظر اندازه و نور پردازی بسیار مهم می باشد. یک نور پردازی غیر مستقیم برای کالایی مثل کاشی می تواند به نام نقاط سطح آن روشانی یکنواخت دهد و در این گونه اجسام تخت همواره باید منابع نور نزدیک تر از دوربین به شیء باشند و علاوه بر این لازم است شیء مورد نظر در تمام تصاویر در یک راستا باشد.

برای آشکار شدن نقص در کالایی مانند کاشی که دارای سطحی با رنگ های مختلف می باشد، از تصاویر با ۲۵۶ سطح خاکستری استفاده می کنیم و تکنیک ۷ تابی را در رابطه با تصاویر سطح خاکستری در نظر می گیریم. با بررسی هیستوگرام نقص های متفاوت بر روی کاشی، می توان گفت سه سطح دودویی برای آشکار سازی نقص کافی است که این سه سطح سطوح با ارزش تر تصویر می باشند.

متأسفانه پس از اعمال الگوریتم ۷ تابی بر روی تصاویر دریافتی از سیستم پیاده سازی شده، نتایج کاملاً دور از ذهن بوده و هیچ استنتاجی از روی آن عملی نبود. علت وجود چنین مشکلی نویز موجود در تصویر دریافتی از CCD و کارت ویدئو همچنین اعوجاج ناشی از نور پردازی غیر ایده آل می باشد. به این ترتیب شاید با امکانات در دسترس نتوانیم به نتایج بهتری در تصاویر دریافتی برسیم. بنابراین در صدد برآمدیم که از روش های پردازش تصویر مقدماتی و روش های آماری در جهت بهبود نتایج استفاده کنیم.

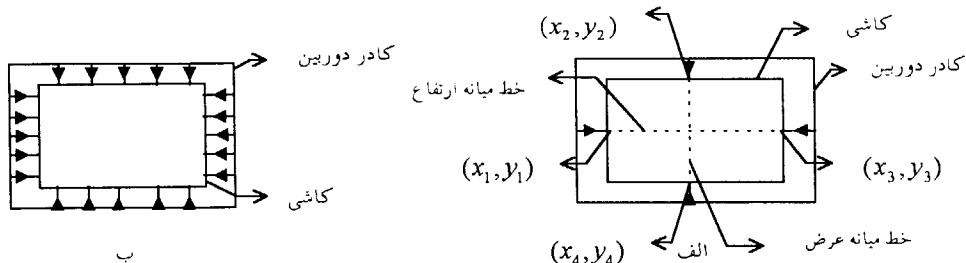
بهینه سازی نتایج

الف - آشکار سازی لبه: از این ابزار جهت جدا کردن کاشی از پس زمینه که در امر شناسایی نقص مشکل ایجاد می کند، استفاده می کنیم. با توجه به اینکه در کالایی مثل کاشی نقص های کوچک (کوچکتر از یک میلی متر مربع) در لبه های آن به حساب نمی آید، حذف حداکثر یک پیکسل از لبه، مشکلی در دسته بندی کاشی ها ایجاد نمی کند. بنابراین یک الگوریتم آشکار سازی لبه، با در نظر گرفتن خصوصیات کاشی در تصویر طراحی می کنیم. فرض می شود با سیستم طراحی شده تمام کاشی ها در راستای کادر دوربین قرار می گیرند، پس می توان یک خط میانه از ارتفاع و عرض تصویر را گرفته و با در نظر گرفتن یک آستانه خاص نقطه ای از لبه را آشکار کرد.^[۷، ۶]

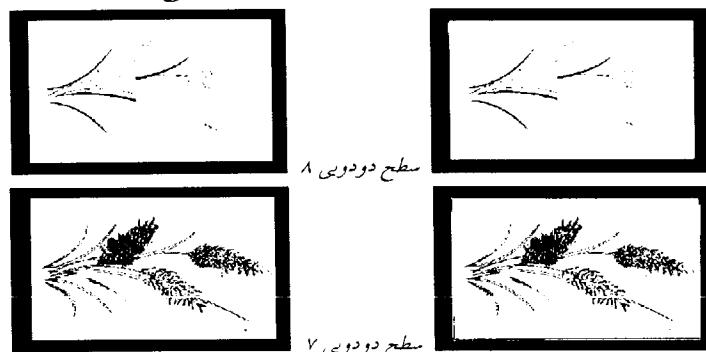
شكل ۵-الف نمایی از عملکرد این روش را نشان می دهد.

برای جلوگیری از خطا در آشکار سازی لبه ناشی از لب پریدگی یا لعب نگرفتگی کاشی این عمل بر روی پنج مسیر از چهار جهت صورت می گیرد(شکل ۵-ب). پس از پیدا کردن مختصات پنج نقطه از هر لبه کاشی، نقاطی

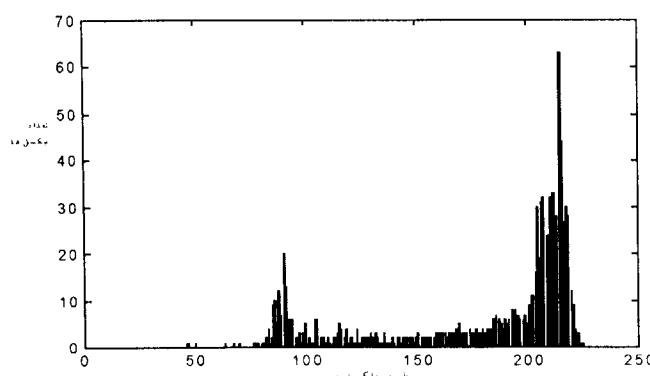
که از مقدار میانگین اختلاف زیادی دارند از مجموعه نقاط لبه حذف می‌گردند. سپس داخلی ترین نقاط لبه از این پنج نقطه مرزی از هر طرف انتخاب می‌شوند و موقعیت قرار گرفتن کاشی در تصویر بدست می‌آید. با مقایسه ابعاد بدست آمده از کاشی و مقادیر واقعی آن اختلاف لبه‌ها را در حد یک یا دو پیکسل اصلاح می‌کنیم.^[۸، ۹]



شکل ۵. الف- نمایش روشی برای پیدا کردن پیکسل‌هایی از لبه ب- آشکارسازی پنج نقطه از هر لبه کاشی به این ترتیب بدون آنکه وقت زیادی تلف شود، با حذف حداکثر یک پیکسل لبه، توانستیم در تصویر دریافتی کاشی را از پس زمینه تصویر جدا کنیم. شکل ۶ عملکرد این روش را بر روی لبه‌ها نشان می‌دهد. چنین آشکارسازی لبه‌ای قبل از اعمال تکنیک ۷ تایی به میزان نسبتاً زیادی در بهبود نتایج موثر می‌باشد.



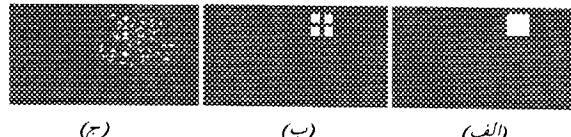
شکل ۶. نمایش ثانیه آشکارسازی لبه بر روی سطوح دوربینی (بر روی تصاویر سمت جپ آشکارسازی لبه انجام گرفته است)
ب- کوانتیزه کردن غیر یکنواخت سطوح خاکستری: با مشاهده هیستوگرام تصویر مربوط به کاشی مورد نظر که در شکل ۷ آمده است، متوجه می‌شویم که اطلاعات تصویری زیر سطح خاکستری ۱۲۸ اطلاعات ناچیزی است و حذف آن مشکلی در آشکارسازی نقص ایجاد نمی‌کند. چون سه سطح دوربینی استفاده می‌شود، بجای تقسیم مساوی، فاصله ۰ تا ۱۲۸ را یک قسمت درنظر می‌گیریم و ۷ قسمت بعدی را بین ۱۲۸ تا ۲۵۶ که اطلاعات بیشتری از تصویر را شامل می‌شود به طور تقریباً مساوی تقسیم می‌کنیم.^[۷، ۱۰]



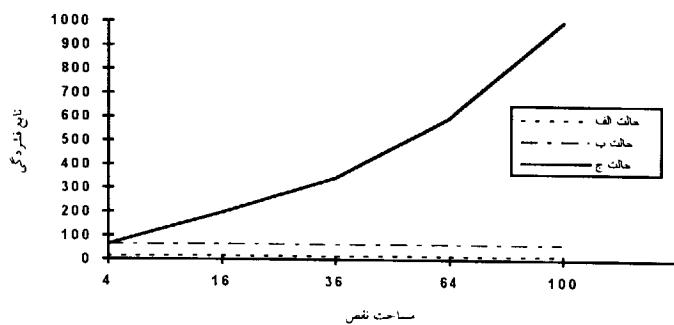
شکل ۷. هیستوگرام مربوط به تصویر کاشی

ج - بررسی فشردگی نقص: همان طور که در بحث تکیک n تایی بیان شد، بر مبنای تابع فشردگی می توان فشرده بودن یا پراکندگی نقص ها را تعیین کرد.

برای روشن شدن این مطلب به تصاویر موجود در شکل ۸ توجه کنید. با تغییر مساحت نقص در حالت های مختلف پراکندگی می توان به نتایج قابل توجهی دست یافت (شکل ۹).



شکل ۸. نمونه هایی از فشردگی های متفاوت نقص در یک شیء مستطیلی



شکل ۹. نمودار تابع فشردگی بر حسب مساحت برای حالت های مختلف نقص
چون در بسیاری از موارد عملی، نقص فشرده نسبت به نقص پراکنده (به صورت نقاط ریز در سطح شیء) از اهمیت بیشتری برخوردار است و از طرفی نویز معمولاً به صورت نقاط پراکنده در تصویر شیء ظاهر می شود و اینکه الگوریتم تکیک n تایی آن را به عنوان نقص تلقی می کند، استفاده از تابع فشردگی در دسته بندی و تشخیص نقص نقش مهمی ایفا می کند و بهتر است معیاری از فشردگی نقص در استنتاجنهایی در نظر گرفته شود.

د - کاهش اثر نویز با میانگین گیری بین تصاویر: همان طور که گفته شد نویز موجود در تصویر دریافتی باعث پایین آمدن دقت در تکیک n تایی می شود. یک راه کاهش نویز، تهیه چند تصویر یکسان از شیء مورد نظر و میانگین گیری بین سطوح خاکستری پیکسل های متناظر در تصاویر تهیه شده می باشد [۱۱]. یک راه مشابه، استخراج تعداد وقوع مشخصه های n تایی در هر یک از تصاویر دریافتی و سپس میانگین گیری بین مشخصه های متناظر است. این کاهش اثر نویز و بالا بردن دقت، به قیمت از دست دادن زمان می باشد.

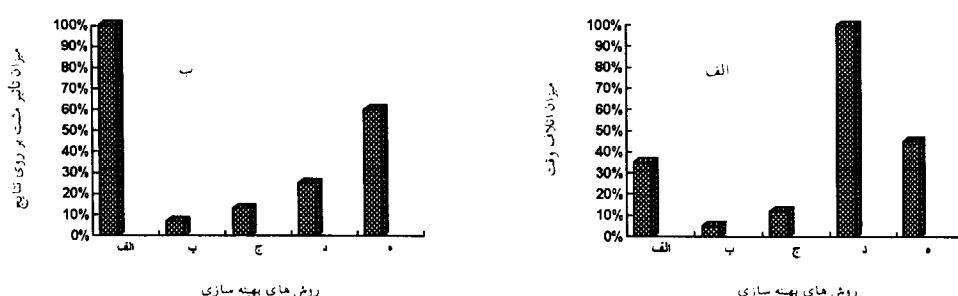
ه - تقسیم تصویر شیء به نواحی مختلف از لحاظ ارزشی: در بسیاری از موارد نقص موجود در نواحی مختلف شیء از اهمیت یکسانی برخوردار نیست. به عنوان مثال اگر نقص کوچکی در ناحیه سفید کاشی رخ دهد به شدت نمایان می شود و یک نقص با اهمیت برای کاشی به حساب می آید. اما اگر همین نقص در ناحیه گل کاشی بوجود آید، چندان محسوس نبوده و می توان از آن صرف نظر کرد. برای اعمال این ایده بر روی کاشی، ابتدا سطح کاشی را بر اساس نقش آن به نواحی مختلف از لحاظ ارزشی تقسیم می کنیم، سپس تکیک n تایی را بر روی هر یک از این نواحی به طور مستقل اعمال کرده و تعداد وقوع مشخصه ها را به طور جداگانه ثبت می کنیم. در مقایسه ای بین تعداد وقوع مشخصه های نواحی مختلف متناظر از کاشی درجه یک و کاشی تحت آزمایش و در نظر گرفتن ضریب اهمیت نواحی، می توان دقت در تشخیص نقص و دسته بندی کاشی ها را تا میزان بالایی افزایش داد. بالا رفتن دقت

در دسته بندی و تشخیص اهمیت نقص در مقابل از دست دادن زمان می باشد و به این ترتیب باید مصالحه ای بین دققت و سرعت بوجود آید که این از طریق تعیین تعداد نواحی تقسیم مناسب عملی می شود.

مقایسه ای بین روش های بهینه سازی نتایج

زمان گرفته شده توسط روش های بهینه سازی فوق در نمودار شکل ۱۰-الف مشاهده می شود. تأثیر هر یک از روش های بهینه سازی در بهبود نتایج در نمودار شکل ۱۰-ب آمده است.

الف - آشکار سازی لبه ب - کوانتیزه کردن غیر یکنواخت ج - بررسی فشردگی نقص د - میانگین گیری بین تصاویر ه - تقسیم تصویر شیء



شکل ۱۰ . الف - نمودار میزان اختلاف وقت توسط روش های بهینه سازی ذکر شده
ب - نمودار میزان تأثیر روش های بهینه سازی ذکر شده در بهبود نتایج

استنتاج نتایج

با بررسی روش های موجود در بهبود نتایج، چهار روش را انتخاب می کنیم. ابتدا با استفاده از آشکار سازی لبه، موقعیت لبه های کاشی را در تصویر مشخص کرده و محدوده کاشی را از پس زمینه جدا می کنیم. سپس کاشی را به نواحی مختلف از لحاظ ارزشی تقسیم کرده و از کوانتیزه کردن غیر یکنواخت برای بهتر آشکار شدن نقص استفاده می کنیم. با محاسبه مساحت و فشردگی نقص در نواحی مختلف از کاشی و در سطوح دودویی ۶، ۷، ۸ و ۹ در نظر گرفتن ضریب اهمیت هر ناحیه به راحتی می توان در درجه کاشی تحت آزمایش تصمیم گرفت. به عنوان مثال یک نمونه جدول دسته بندی کاشی بر مبنای مساحت و فشردگی نقص که به صورت تجربی به دست آمده در مساحت نقص به یکسل

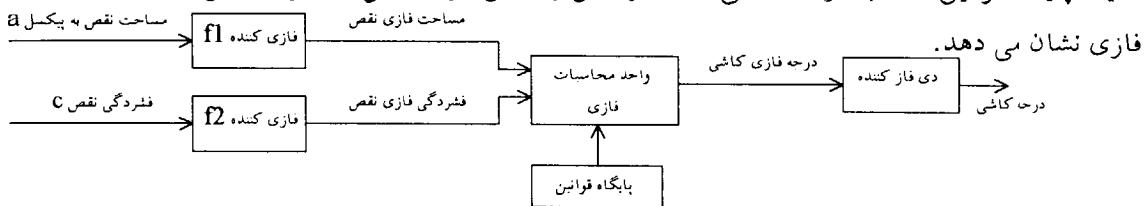
شکل ۱۱ مشاهده می شود.

فشردگی نقص	درجه ۱	درجه ۲	درجه ۳	درجه ۴	درجه ۱	درجه ۲	درجه ۳	درجه ۴
درجه ۱	۱۰	۱۵	۲۰	۲۵	۱۰	۱۵	۲۰	۲۵
درجه ۲	۱۰	۱۵	۲۰	۲۵	۱۰	۱۵	۲۰	۲۵
درجه ۳	۱۰	۱۵	۲۰	۲۵	۱۰	۱۵	۲۰	۲۵

شکل ۱۱ . نمونه جدول دسته بندی کاشی بر مبنای مساحت و فشردگی نقص

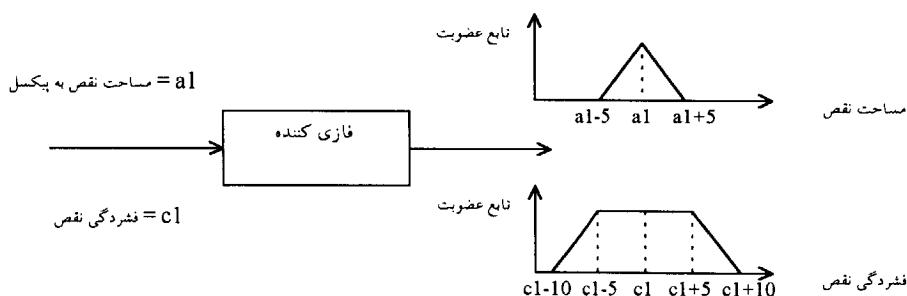
به این ترتیب با تغییر بازه های درجه بندی می توان معيار دسته بندی کاشی ها را به دلخواه تغییر داد. در نهایت نتایج اعمال دسته بندی برای هر یک از سطوح دودویی ۶، ۷، ۸ و ۹ به طور مجزا توسط جدول مربوطه مشخص شده و بزرگترین عدد حاصله (بدترین حالت) به عنوان درجه کاشی اعلام می گردد. به این ترتیب یک دسته بندی نسبتاً دقیق بر روی کاشی صورت می گیرد.

استنتاج فازی: برای افزایش قابلیت اطمینان و مقاوم تر کردن نتایج درجه بدی کاشی ها می توان از استنتاج فازی کمک گرفت. با معلوم بودن بازه های درجه بندی، به راحتی می توان آنها را به بازه های فازی تبدیل کرده و با یک پایگاه قوانین مناسب درجه کاشی تحت آزمایش را تعیین کرد. شکل ۱۲ روای تعیین درجه را از طریق استنتاج فازی نشان می دهد.



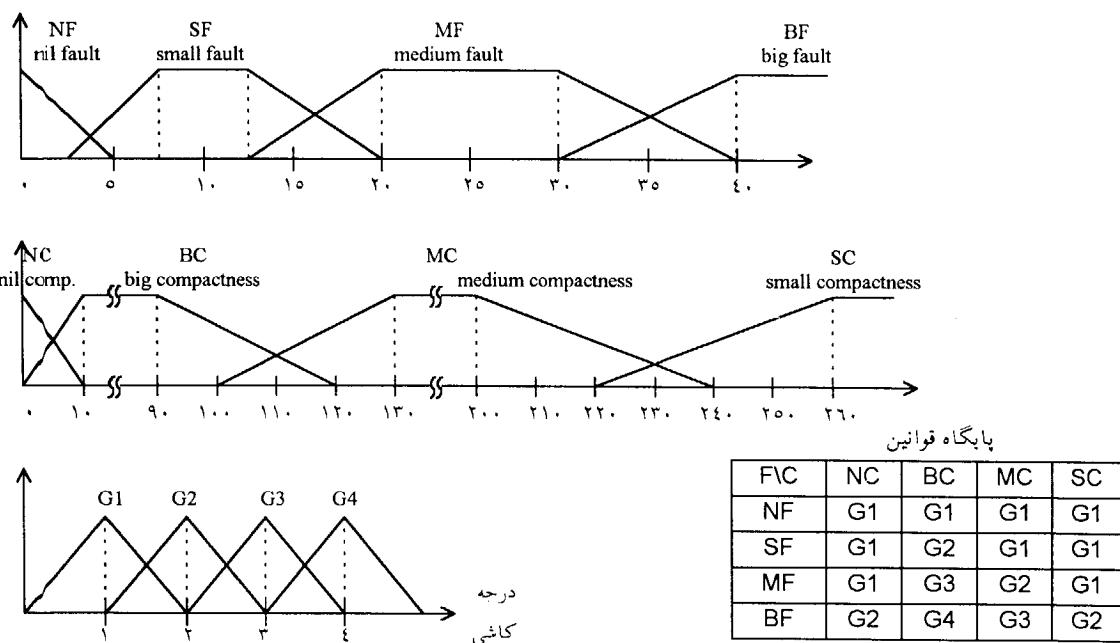
شکل ۱۲. روای تعیین درجه از طریق استنتاج فازی

مساحت و فسردگی نقص از طریق توابع فازی کننده به شکل فازی تبدیل می شوند (شکل ۱۳).



شکل ۱۳. تبدیل کردن مساحت و فسردگی نقص به حالت فازی

عدد فازی مساحت و فسردگی نقص با بازه های فازی متناظر آنها توسط واحد محاسبات فازی مقایسه می شود و با توجه به پایگاه قوانین، درجه فازی کاشی تعیین می گردد (شکل ۱۴).

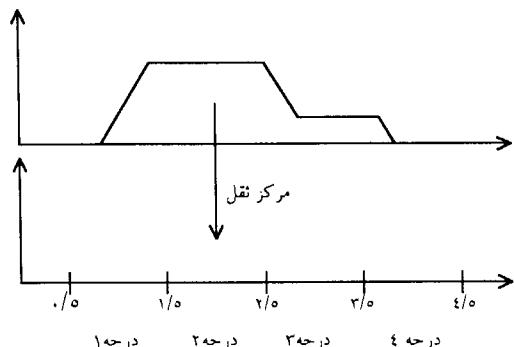


شکل ۱۴. بازه های فازی مساحت و فسردگی نقص، درجه فازی کاشی و پایگاه قوانین

سپس این درجه فازی تعیین شده، توسط یک دی فاز کننده که روش مرکز نقل را به کار می برد، درجه نهایی کاشی تحت آزمایش را مشخص می کند (شکل ۱۴). [۱۲]

جمع بندی نتایج

هدف از این مقاله معرفی روشی جدید جهت شناسایی نقص در تصاویر بر مبنای تکنیک n تابی بوده و در راستای بهبود نتایج ابزارهای پردازش تصویر نیز به کار گرفته شده است. به عنوان نمونه عملی، روش مورد نظر به منظور درجه بندی کاشی به کار گرفته شده و نتایج قابل توجهی به همراه داشته است. تشخیص نقص کاشی توسط این سیستم با دقت خوب و در زمانی کوتاه انجام می‌گیرد، به این ترتیب اجرای این سیستم در تعیین کیفیت کاشی موفقیت آمیز بوده است.



شکل ۱۸ . دی فاز کننده درجه کاشی

مراجع

- [1] Ouslim, M., Curtis, K.M. " Automatic visual inspection based upon a variant of the n-tuple technique", IEE Proc.-Vis. Image Signal Process., Vol.143, No.5, pp.301-309 (1996)
- [2] Ouslim, M., Curtis, K.M., and Belmekki, B. " Recognition method using the n-tuple technique with different input mappings ", International conference on Electrical and electronic engineering, ICEEE'94, Oran, pp.28-33 (1994)
- [3] Vernon, D. " Machine vision: automated visual inspection and robot vision " Prentice-Hall! (1991)
- [4] Yasuhiko, H., Hideaki, D., and Koichi, K. " A system for PCB automated inspection using fluorescent light ", IEEE Trans., PAMI-10, pp. 69-77 (1988)
- [5] Aleksander, I., and Wilson, D.M.J.: "Adaptive windows for image processing", IEE Proc. E, 1985, 132, (5), pp. 233-245
- [6] Parker, J.R. " Algorithms for image processing and computer vision ", John Wiley & Sons, Inc. (1997)
- [7] Gonzalez, R.C., and Wintz, P. " Digital Image Processing ", Addison Wesley (1987)
- [8] Wu, Q.M., and Rodd, M.G. " Fast boundary extraction for industrial inspection " Pattern Recognition Letters, Vol.12, No.8, pp.483-489, (1991)
- [9] Yokio, S., Toriwaki, J.I., Fukumura, T. " An analysis of topological properties of digitized binary pictures using local features " Computer Graphics and Image Processing (1), pp.63-73 (1975)
- [10] Burdick, H.E. " Digital imaging theory and application ", McGraw-Hill (1996)
- [11] Low, A. " Introductory computer vision and image processing ", McGraw-Hill (1991)
- [12] Zimmermann, H.J. " Fuzzy set theory and its applications " (1994)